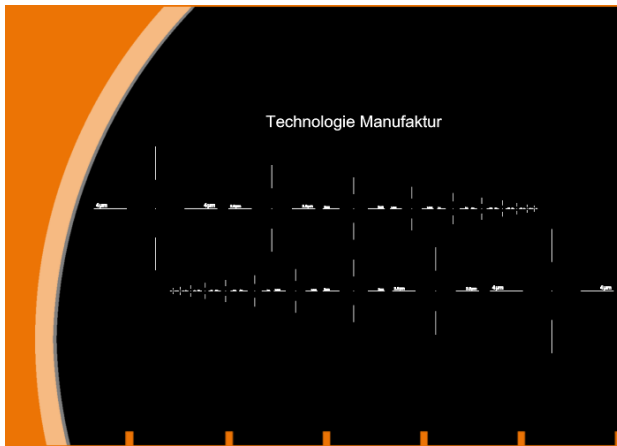


Sterntest TC-ST01

Pinholes in Stufenreihen von 0.18 μm - 4 μm



Auf diesem Testchart sind Pinholes von 0.18 μm bis 4 μm Durchmesser angeordnet. In zwei Reihen finden sich die identisch abgestuften Pinholes in umgekehrter Reihenfolge. Um die Pinholes ist entsprechend ihrer Größe für genügend dunkle Fläche gesorgt, um das gesamte Sehfeld des zu prüfenden Objektivs abzudunkeln. Die Pinholes eignen sich für den Sterntest von Mikroobjektiven und für allgemeine optische Entwicklungsaufgaben.

Unsere hochauflösenden Testcharts sind mit hochpräziser E-Beam-Lithographie hergestellt. Als Träger dient ein Quarzsubstrat mit breiter spektraler Transmission (DUV-VIS-NIR), auf das eine Chromschicht hoher optischer Dichte aufgetragen ist. Die Teststrukturen werden durch die Abtragung der Chromschicht erzeugt, wobei Strukturgrößen bis zu 100 nm möglich sind und eine exzellente Maßhaltigkeit und Geradheit der Strukturkanten gewährleistet ist.

Substrat	Quarzwafer (Fused Silica), 20mm x 10mm x 1mm (siehe Layout auf nächster Seite)
Träger	Objekträger-Format 75mm x 25mm x 1.5mm, Edelstahl mit Lasergravur
Strukturierte Schicht	Chrom, optische Dichte OD > 8@400nm / 6@550nm / 4.5@750nm / 3.6@1 μm
Pinhole-Abstufung (Durchmesser)	4.0 μm , 2.8 μm , 2.0 μm , 1.4 μm , 1.0 μm , 0.7 μm , 0.5 μm , 0.35 μm , 0.25 μm , 0.18 μm
Maßhaltigkeit (max. Absolutfehler)	100 nm/cm = 10^{-5}
Spektraler Transmissionsbereich	200nm – 2000nm

Sterntest TC-STO1 Layout

